

Ecole d'été 30 juin au 5 juillet 2024 - Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et Microanalyses

horaire	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
08h00 – 09h10		(8H00 accueil) Discours d'accueil, Informations générales	La formation et l'optimisation de l'acquisition des images 5	Introduction aux cartographies d'orientation 10	Analyse d'échantillons stratifiés 15	Contrôle de connaissance quizz
09h15 – 09h55		Les canons à électrons des MEB W et FEG 1	L'émission X 6	MEB à pression contrôlée 11	Préparation des échantillons/métallisation 16	TD au choix pour tous
09h55 – 10h40		Les colonnes électroniques des MEB 2	Technologie EDS et traitement des spectres 7	Microscopie double colonne MEB-FIB 12	Préparations d'échantillons fragiles 17	
10h40 – 11h10		Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
11h10 – 11h55		Interactions électron- matière et émission électronique 3	Technologie WDS et traitement des spectres 8	Cartographies spectrales 13	Notions de traitement statistique 18	TD au choix pour tous
11h55 – 12h40		Les différents types de détecteurs d'électrons 4	L'analyse X quantitative 9	Imagerie et microanalyse à basse tension 14	Contrôle et maintenance du MEB et de l'EDS 19	
12h40 – 14h00		Repas	Repas	Repas	Repas	Repas
14h00 – 15h45	Accueil à partir de 15h Buffet de 19h à 20h30	TD-Niv1a MEB instruments et calibration TD-Niv2	TD-Niv1a MEB acquisition d'images TD-Niv2	TD-Niv1a MEB acquisition EDS TD-Niv2	TD au choix pour tous	Remise docum attestation présence
15h45 – 16h30		Pause	Pause	Pause		Sortie culturelle
16h30 – 18h00		TD-Niv1b MEB instrument et détecteurs TD-Niv2	TD-Niv1b MEB acquisition d'images TD-Niv2	TD-Niv1b MEB acquisition EDS TD-Niv2		
18h00 – 19h00		Démonstrations constructeurs sur les instruments	Démonstrations constructeurs sur les instruments	Démonstrations constructeurs sur les instruments	Banquet	
19h00 – 21h00		Soirée libre	Soirée libre	Soirée libre		